



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 346/2025

Mitutoyo Česko s.r.o.
se sídlem Dubská 1635, 415 01 Teplice
IČO 25458400

pro kalibrační laboratoř č. **2390**
Kalibrační laboratoř

Rozsah udělené akreditace:

Kalibrace měřidel v oboru délka a rovinný úhel, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 302/2025 zde dne 23. 6. 2025, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **21. 11. 2029**

V Praze dne 9. 7. 2025



Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mitutoyo Česko s.r.o.
objekt číslo 2390, Kalibrační laboratoř
Dubská 1635, 415 01 Teplice

CMC pro obor měřené veličiny: Délka

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Praco- viště
		min	jedn.	max	jedn.					
1*	Souřadnicové měřicí stroje (CMM) Prostorová délka Chyba snímacího systému	0 m -1 mm	až až	5 m 1 mm			(0,3L + 0,1) μm 0,2 μm	Měření laserovým interferometrem Měření referenční koulí	MCZ-PI-KL_SD15_KP01 (ČSN EN ISO 10360-2, ČSN EN ISO 10360-5)	
2*	Souřadnicové měřicí stroje vybavené kamerovým systémem (VMM) osa X, Y osa Z	0 m 0 m 0 m	až až až	1 m 1 m 0,3 m			(2,4L + 0,2) μm (2,4L + 0,2) μm (3,1L + 0,3) μm	Měření pomocí skleněného měřítka Měření pomocí skleněného měřítka Měření pomocí koncových měrek	MCZ-PI-KL_SD15_KP06	
3*	Přístroje na měření drsnosti povrchu Ra Rz Rsm Chyba měření linearity Chyba měření přímosti	0,1 μm 0,01 μm 0,1 μm -400 μm -15 μm	až až až až až	50 μm 50 μm 400 μm 400 μm 15 μm			3,4 % 2,4 % 0,6 % 4 μm 0,06 μm	Porovnání s etalonem drsnosti Měření etalonem linearity UDT Měření etalonem optické roviny	MCZ-PI-KL_SD15_KP02 (ČSN EN ISO 3274, ČSN EN ISO 12179)	
4*	Přístroje na měření profilu povrchu osa X, Y osa Z Chyba při měření přímosti	0 mm 0 mm -15 μm	až až až	200 mm 60 mm 15 μm			(0,3L + 0,2) μm (0,3L + 0,2 μm 0,06 μm	Měření laserovým interferometrem Měření pomocí koncových měrek Měření etalonem optické roviny	MCZ-PI-KL_SD15_KP02 (ČSN EN ISO 3274, ČSN EN ISO 12179)	

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mitutoyo Česko s.r.o.
objekt číslo 2390, Kalibrační laboratoř
Dubská 1635, 415 01 Teplice

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
5*	Profil projektory	0 mm	až	200 mm			(8,9L + 1,2) μm	Měření pomocí skleněného měřítka	MCZ-PI-KL_SD15_KP03	
	Rovnoběžnost P _{XY}	-200 μm		200 μm			1 μm			
	Pozice nitkového kříže E _{CH}	-200 μm		200 μm			4 μm			
	Chyba zvětšení	-1 %		1 %			0,01 % (abs.)			
	Měřicí mikroskopy	0 mm	až	400 mm			(8,9L + 1,2) μm			
	Rovnoběžnost P _{XY}	-200 μm		200 μm			1 μm			
6*	1D měřicí přístroje (výškoměry)	0 m	až	1 m			(0,23L + 0,05) μm	Měření laserovým interferometrem	MCZ-PI-KL_SD15_KP04	
7*	Kruhoměry							Měření etalonem linearoty UDT Měření referenční polokoulí Měření referenční polokoulí Měření referenčním válcem	MCZ-PI-KL_SD15_KP05	
	Chyba měření linearoty snímače	-400 μm	až	400 μm			4 μm			
	Axiální házení vřetena	-200 μm	až	200 μm			0,02 μm			
	Radiální házení vřetena	-200 μm	až	200 μm			0,04 μm			
	Válcovitost	0 μm	až	200 μm			1,8 μm			

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratoří dosažitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

Vysvětlivky:

L - délka vyjádřená v metrech

Rovnoběžnost P_{XY} - rovnoběžnost křížového stolu s nitkovým křížem P_{XY}

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mitutoyo Česko s.r.o.
objekt číslo 2390, Kalibrační laboratoř
Dubská 1635, 415 01 Teplice

CMC pro obor měřené veličiny: Rovinný úhel

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Praco- viště
		min	jedn.	max	jedn.					
1*	Chyba měření úhlu v rovině XZ / Přístroje na měření profilu povrchu			135 °			0,0034°	Měření úhlové měrky 135°	MCZ-PI-KL_SD15_KP02 (ČSN EN ISO 3274, ČSN EN ISO 12179)	
2*	Chyba měření úhlu / Profilprojektory			360 °			0,5'	Měření polohy skleněného měřítka otočením matnice o 360°	MCZ-PI-KL_SD15_KP03	

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratoří dosažitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).